

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月27日(27.10.2022)



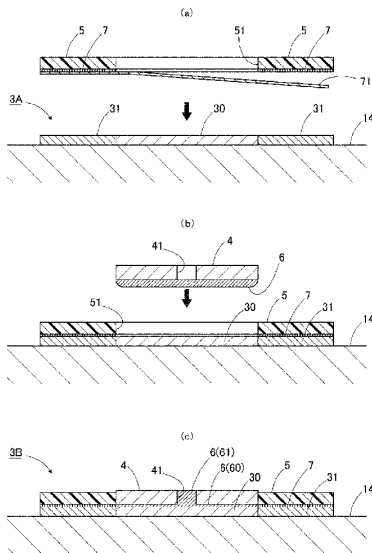
(10) 国際公開番号

WO 2022/224438 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/66 (2006.01) *G01R 1/073* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/016446
- (22) 国際出願日: 2021年4月23日(23.04.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 日本電子材料株式会社 (JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION)
[JP/JP]; 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 富田 浩 (TOMITA Yutaka); 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号 日本電子材料株式会社内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 大槻 聡 (OHTSUKI Satoshi); 〒5406125 大阪府大阪市中央区城見2-1-6 1 ツイン 2 1 M I D タワー 2 5 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: PROBE CARD AND METHOD FOR REPAIRING PROBE CARD

(54) 発明の名称: プローブカード及びプローブカード補修方法



(57) Abstract: [Problem] The purpose of the present invention is to provide a probe card repair method for repairing a probe card in which a defect has occurred in an alignment symbol or a peripheral region thereof by using a high-reflection chip for alignment. [Solution] The present invention is provided with a probe 16 for contacting an object being inspected, a wiring substrate 14 to which the probe 16 is attached, and a high-reflection chip 4 for alignment provided to a probe installation surface 17 of the wiring substrate 14. The high-reflection chip 4 comprises a metal plate having a through-hole 41 for fixing, and has an affixing surface to be affixed to the probe installation surface 17 with an adhesive 6 interposed therebetween and a mirror-finished high-reflection surface on the other side from the affixing surface. The adhesive 6 formed on the affixing surface has a ridge 61 that extends into the through-hole 41 for fixing.

(57) 要約: 【課題】アライメント用の高反射チップを用いて、アライメントシンボル又はその周辺領域に欠陥が発生したプローブカードを補修するプローブカード補修方法を提供することを目的とする。【解決手段】検査対象物と接触させるプローブ16と、プローブ16が取り付けられる配線基板14と、配線基板14のプローブ設置面17に設けられたアライメント用の高反射チップ4と、を備え、高反射チップ4が、固着用貫通孔41を有する金属板からなり、接着剤6を介してプローブ設置面17に貼付される貼付面と、貼付面とは他方の鏡面加工された高反射面とを有し、貼付面に形成された接着剤6が固着用貫通孔41内に延びる隆起部61を有する。

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))